PATENT ABSTRACTS OF JAPAN



(11)Publication number: 59-022381 (43)Date of publication of application: 04.02.1984

(51)Int.CI.

H01S 3/18 // H01S 3/096

(21)Application number: 57-131186

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

29.07.1982

(72)Inventor: SUGIURA YOSHINORI

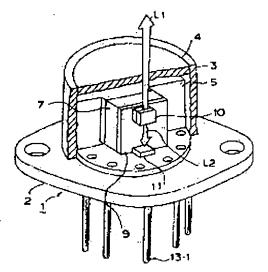
ICHIKAWA JUNJI

(54) SEMICONDUCTOR LASER DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To form the semiconductor laser device of excellent temperature characteristics by arranging a semiconductor laser element near a self-temperature control element in a sealed vessel.

CONSTITUTION: One end of a cylindrical section 3 is sealed by glass 4, and a sealed space is formed by the cylindrical section 3, a base section 2 and glass 4. A heat-insulating block 5, one part thereof is fixed to the cylindrical section 3 and the base section 2, is set up in such a sealed space, and a heating element 7 is fixed onto the block 5. The self-temperature control type heating element of an equipment such as a positive characteristic thermistor is used as the heating element 7. Consequently, the heating element 7 can be kept at a more stable temperature because heat from the outside is interrupted by the heat-insulating block 5 in the heating element 7 and a current value is controlled so that the temperature of element itself is kept constant. On the other hand, a thermal good conductive material 9



is fast stuck and fixed onto the heating element 7, and a semiconductor laser element 10 is placed and fastened onto said material. Accordingly, only the semiconductor laser element 20 may be heated regarding the heating element 27, small amount of exothermic energy may be sufficient, and thermal capacity can also be reduced, thus enabling the control of the temperature of the element with excellent response.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

(9) 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-22381

⑤Int. Cl.³H 01 S 3/18// H 01 S 3/096

識別記号

庁内整理番号 7377-5F 7377-5F ❸公開 昭和59年(1984)2月4日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 4 頁)

99半導体レーザ装置

创特

願 昭57-131186

②出

願 昭57(1982)7月29日

⑫発 明

者 杉浦義則

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キャノン株式会社内 . 砂出 願 人

明 考

70発

2 号キヤノン株式会社内 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

市川潤二

邳代 理 人 弁理士 大塚康徳

明 細 書

1. 発明の名称

半導体レーザ装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1 封止容器中において半導体レーザ泉子を自己温度制御寮子近傍に配置したことを特徴と する半導体レーザ装置。
 - 2 封止容器中に半導体レーザ案子と前記半導体レーザ案子からの出射光を受光する光検出 案子を設け、前記半導体レーザ案子と光検出 案子の近傍に自己隔度制御案子を配置したこ とを特徴とする半導体レーザ装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は半導体レーザ素子からの出射光の波長 変動を少なくすることが出来る半導体レーザ装置 に関するものである。

半導体レーザ系子は周囲温度の変化に伴ない光 出力の変動を生じるばかりか、レーザ発振波長の シフトが生じる。

これらのことから、半導体レーザ系子を画像記録等に用いる場合は、 装置に使用される感光体の感 度の波長依存性が大きな問題となる。

従来より、光通信等の分野で半導体レーツ衆子を光源として用いることは広く行なわれている。かかる場合に於いて、半導体レーツの光出力を一定パワーに保つ、 Auto Power Oontrol(以下 A P O と呼ぶ)を採用する事が多い。

このようなAPOに用いる光検出器としては、

特開昭59-22381(2)

使用の容易さの点等から半導体光電変換案子が多用されているが、半導体の光検出器を用いた場合、 光検出器自体の特性の温度変化があり、精度の良い制御の妨げとなる。

特に半導体レーザの発する赤外光領域においては、光検出器の温度による検出感度変化が著しい。 従つて、精度の良い光量制御を行なう為には、光 検出器自体とも恒温槽に入れる等の温度制御を行 なう事が好ましいものである。

又、半球体レーツの出力光の一部を光検出器に入射させるためには出力光をハーフミラーで分割する等の光学装置をも必要とするので上述の如き制御を別個に行なうと半導体レーツ装置の構成が複雑となる。

本発明はかかる複雑な構成を用いる事なく、温度特性の良好な半導体レーザ装置を提供するもの

従つて発熱来子では断熱プロック 5 によつて外界からの熱が遮断されていなおかつ自分で一定健康になるよう電流値が制御されるため、より安定した温度に保つことが可能になる。一方前配発素子で上には熱良導材 9 が 敬聞 固定され、その上に半導体レーザ素子 1 0 は 例えば第2 図に示す如く、正電極用コンタクト 1 1、 P層12、N層 1 3、 負電極用コンタクト 1 1、 P層12、N層 1 3、 負電極用コンタクト 1 1、 1 4 間 成したものであり、 前配コンタクト 1 1、 1 4 間 に電源を印加する。

第1図において、前配レーザ案子10はレーザ 光 Liが前配ガラス4に向つて放射される如く固定 するものであるが、かかる熱良導材9上において レーザ光 Liの光路上には酸レーザ光 Liを受光する 第1図は本発明の実施例であつて、半導体レーサ 発子をメタルキャンタイプ 10ケース内に収容

であり、以下図面により貯述する。

した協合の断而図であり、図面の都合上各案子のリード線は省略してある。

1 で示すのはメタルキャンタイプの1 Cケースであり、このケース1 は金属より成る著台部 2 と 酸素台部 2 と一体に設けた円筒部 3 より成るものである。かかる円筒部 3 の一端はガラス 4 により対止されており、円筒部 3 と基台部 2 とガラス 4 により密閉空間を形成するものである。

かかる密閉空間内には、その一部を前記円筒部3 及び善台部2に固定した断熱プロック5を殴け、 このプロック5上には発熱茶子7が固定されてい る。前記発熱茶子7は、例えば正特性サーミスタ 等の自己温度側御形発熱素子が用いられる。

如く、フォトダイオードの如き光検出器11を載置する。13-1で示すのはケース1内に収納された案子を外部回路に接続する為のピンである。 但し、ケース内の案子と前記ピンとを接続する接続線は図面の繁雑化を妨ぐ為に図示していない。

第3図で示すのは前述の如き半導体レーザ装置の制御回路を示すものであり、14-1で示すのは前記光検出器11で検出した検出信号により、前記レーザ素子10を駆動する駆動電源を制御して、レーザ光Li, Lzが常に一定となる如く制御する光量制御回路である。

15は発熱素子7の電源で、電源からほぼ一定の 電圧を供給する。このことにより発熱素子7は自 分自身で一定温度になる機に電流がコントロール される。

以上の如き構成によれば、出力レーサ光上は周

特開昭59-22381(3)

明弘度変化、レーツネ子の経年変化によらず常に一定の出力で一定の発掘放長とすることができ、また光検出器を同一の発熱ステ上に敬催することで極めて正確に側御することができる。

なお、本発明の実施は必ずしも第 1 図の如きケースを用いなくても良いが第 1 図の構成ではケース全体を放熟面として利用出来る。又、ケース内部を真空封じとすれば、ガラス面の顕結防止に有効である。

第4図は他の実施例を示したもので、比較的温度依存性の少ない光検出器を用いることにより、 半導体レーザ素子のみを発熱素子婚部上に戦闘固定した例を示すものである。

半導体レーザ象子をメタルキャンタイプ I O ケース内に収容した場合の断面図であり、図面の都合上各衆子のリード級は省略してある。 1 9 で示

すのはメタルキャンタイプのIOケースでありこのケース19は金属より成る結合部22と版結合のかかる円筒部23の一端はガラス24により対止されており、円筒部23と括台部22とガラス24により的部23と括台部22とガラス24により的別空間が形成されている。かかる密閉空間内にはその一部を設け、このプロックを設け、こので開発を開発を発展になる機能になるのはでであると自分自己のののではでは、カスタの自己は関係を発展である。無限では、カスタの自己は関係を発展である。には半導体レーデスタの自己には半導体レーデスタのを破したのとには半導体レーデスタのを破している。無限では、カスタの自己には半導体レーデスタの自己には半導体レーデスタのを破している。無限では、1000には

前記半導体レーサ票子より発せられた光Leを受

光するためのフォトタイオードの如き光検出器21 . は、基台 2 2 上に設置された基板 3 0 上に収置する。

この方式によれば発熱案子 2 7 は半導体レーザ 案子 2 0 のみを加熱するだけでよく、発熱エネル ヤーが少なくて済み、また熱容量も少なくするこ とが可能なため応答のよい温度コントロールが可 能となる。

以上述べた如く、本発明によればレーザ光は周囲温度の影響を受けることなく、又経年変化等の影響を受けることなく略一定の波長となるものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による半導体レーザ装置を示す 一部断面斜視図、第2図は半導体レーザ素子を示 す斜視図、第3図は半導体レーザ装置の制御回路 図、第4図は他の実施例による半導体レーザ装置を示す一部断面斜視図である。ここで5,25は断熱プロック、7,27は発熱架子、9,29は熱良導材、10,20は半導体レーザ案子、Li,Liはレーザ光、11,12は光検出器である。

特 許 出 顧 人 お ヤ ノ ン 株 式 会 社 代理人 弁理士 大 塚 康 像

